

Curso: Engenharia Elétrica	Série: 4º / 5º semestre	Turma: A
Disciplina: Materiais Eletroeletrônicos	Período: NOTURNO	Data da Prova: 29/06/2015
Professor: Msc. Cristiano Malheiro	RA:	NOTA:
Nome do Aluno: <i>GABARITO</i>		

### PROVA – Materiais Eletroeletrônicos – PROVA B

Atenção:

- Proibido utilizar qualquer material de consulta sob pena de retirada de prova e atribuição de nota “0”. Uso permitido apenas de calculadora científica (exclui-se tablets, celulares e calculadoras gráficas).
- Tempo de prova: 90 minutos. As respostas finais devem ser apresentadas à caneta para revisão da mesma em sala de aula. Boa Prova!

**Gabarito de Respostas**  
 (Utilizar no mínimo 3 casas decimais nas respostas finais)

1. C	2. A	3. C	4. A	5. E	6. C
7.	$x_{ox} = 3625 \times 10^{-6} \text{ cm}$	$C_{SImin} = 4,75 \text{ nF/cm}^2$	$dmáx = 24,67 \times 10^{-6} \text{ cm}$	$N_a = 1,462 \times 10^{10} / \text{áreas/cm}^3$	

1. Os espaços vazios em uma célula unitária chamamos de: (1,0 ponto)

- a) Estruturas cristalinas.
- b) Estruturas desordenadas
- c) Interstícios.
- d) Estruturas aleatórias
- e) Insterstícios aleatórios.



Anhanguera

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN

Unidade SBC: Av. Rudge Ramos, nº 1.501 • São Bernardo do Campo (SP) • 09636-000 • (11) 4362-9000

2. Quando um elétron passa de uma camada para outra, no modelo de Bohr ele emite: (1,0 ponto)

- a) Um fóton de energia.
- b) Uma energia intrínseca.
- c) Uma energia forte e se aniquila.
- d) Dois fótons de energia.
- e) Energia para o próton.

3. (Modificaod- Concurso-Metrô 2014) Cristal de silício dopado com átomos pentavalentes e trivalentes corresponde respectivamente a: (1,0 ponto)

- a) Silício Extrínseco Tipo P e Silício Extrínseco Tipo N.
- b) Silício Intrínseco Tipo P e Silício Intrínseco Tipo N.
- c) Silício Extrínseco Tipo N e Silício Extrínseco Tipo P.
- d) Silício Intrínseco Tipo N e Silício Intrínseco Tipo P.
- e) Silício Intrínseco Tipo N e Silício Extrínseco Tipo P.

4. A estrutura cristalina CCC e CFC possuem respectivamente: (1,0 ponto)

- a) 2 e 4 átomos na célula unitária.
- b) 4 e 2 átomos na célula unitária.
- c) 2 e 2 átomos na célula unitária.
- d) 1 e 3 átomos na célula unitária.
- e) Nenhuma das anteriores.

5. No diagrama de bandas de energia, a região onde existem o mar de elérons e de lacunas é respectivamente nas: (1,0 ponto)

- a) Bandas de valência e condução
- b) Bandas de nível intrínseco e valência
- c) Bandas de condução e nível intrínseco
- d) Bandas de Fermi e valência
- e) Bandas de condução e valência

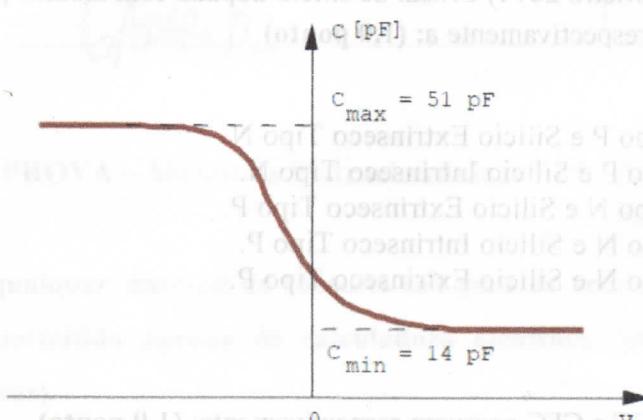
6. O capacitor encontra-se na região de depleção quando: (1,0 ponto)

- a) Acumula lacunas na interface Si- SiO<sub>2</sub>.
- b) Acumula elétrons na interface Si- SiO<sub>2</sub>.
- c) Acumulam elétrons e lacunas na interface Si- SiO<sub>2</sub>.
- d) Não acumula nenhum portador.
- e) Quando a capacitância é máxima.

7. Dada a curva CV abaixo, medida em um capacitor MOS quadrado de  $215\mu\text{m}$ , determinar:

- Espessura do óxido de porta ( $x_{ox}$ ) em centímetros (cm) (0,5 ponto)
- Capacitância mínima do silício ( $C_{Si\min}$ ) (0,5 ponto);
- Espessura de depleção máxima ( $d_{max}$ ) em centímetros (cm) (1,0 ponto);
- Concentração de Aceitadores ( $N_A$ ) (1,0 ponto).

Dados: Considerar  $KT/q = 25\text{mV}$ .



Constantes a serem adotadas, caso necessário:

- Carga do elétron ( $q$ ) =  $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;
- Permissividade do óxido: ( $\epsilon_{ox}$ ) =  $40 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ ;
- Permissividade do silício: ( $\epsilon_{si}$ ) =  $1,03 \times 10^{-12} \text{ F/cm}$ ;
- Densidade intrínseca de portadores SI (300K):  $n_i = 1,45 \times 10^{10} \text{ PEL/cm}^3$ ;
- Constante de Boltzman ( $K$ ) =  $8,62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$ ;
- Adotar na primeira iteração  $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ lacunas/cm}^3$ .

$$\textcircled{a} \quad C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{x_{ox}} \cdot A$$

$$51 \times 10^{-12} = \frac{40 \times 10^{-14}}{x_{ox}} \cdot (215 \times 10^{-4})^2$$

$$\therefore x_{ox} = 3,625 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

$$\textcircled{b} \quad C_{max} = C_{ox} \cdot A \rightarrow C_{ox} = \frac{51 \times 10^{-12}}{(215 \times 10^{-4})^2} \quad \therefore C_{ox} = 110,33 \text{nF/cm}^2$$

$$\underline{C_{min}} = \underline{C_{ox} \cdot C_{simin}}$$

$$\underline{A} \quad \underline{C_{ox} + C_{simin}}$$

$$\frac{14 \times 10^{-12}}{(215 \times 10^{-4})^2} = \frac{(110,33 \times 10^{-9} \cdot C_{simin})}{110,33 \times 10^{-9} + C_{simin}}$$

$$14 \times 10^{-12} \cdot (110,33 \times 10^{-9} + C_{\text{simin}}) = (215 \times 10^{-4})^2 \cdot (110,33 \times 10^{-9} \cdot C_{\text{simin}})$$

$$1,545 \times 10^{-18} + 14 \times 10^{-12} C_{\text{simin}} = 5,9 \times 10^{-11} C_{\text{simin}}$$

$$\boxed{C_{\text{simin}} = 41,75 \text{ nF/cm}^2}$$

(c)  $\rho_{\text{máx}} = \frac{\epsilon_{\text{ri}}}{C_{\text{simin}}} = \frac{1,03 \times 10^{-12}}{41,75 \times 10^{-9}}$   $\boxed{\rho_{\text{máx}} = 24,67 \times 10^{-6} \text{ cm}}$

(d)  $N_d = h \cdot \epsilon_{\text{ri}} \cdot K \cdot T \ln \left( \frac{N_e}{N_i} \right)$

$$q^2 \cdot \rho_{\text{máx}}^2$$

$$N_d = 4 \cdot 1,03 \times 10^{-12} \cdot 25 \times 10^{-3} \cdot \ln \left( \frac{5 \times 10^{15}}{1,45 \times 10^{10}} \right)$$

$$1,6 \times 10^{-19} \cdot (24,67 \times 10^{-6})^2$$

1º:  $N_d = 1,348 \times 10^{16} / \text{seusas/cm}^3$

2º:  $N_d = 1,454 \times 10^{16} / \text{seusas/cm}^3$

3º:  $N_d = 1,461 \times 10^{16} / \text{seusas/cm}^3$

4º:  $N_d = 1,462 \times 10^{16} / \text{seusas/cm}^3$